

INTB8V2AC1

ESD保護用
シリコンエピタキシャル形(コモンアノード)

概要

INTB8V2AC1は、超小形外形樹脂封止形シリコンエピタキシャル形ダイオードです。

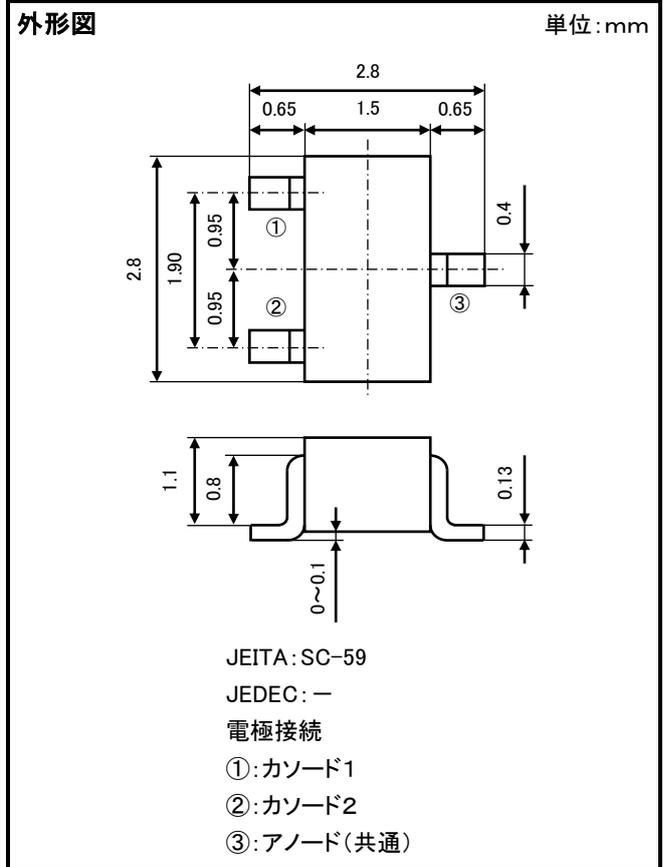
IEC61000-4-2試験に基づき、気中放電にて15kV、接触放電にて8kVのESD耐量を保証しており、外部インターフェイス回路等のESD保護用途として最適です。

特長

- 小型パッケージの2素子を搭載(コモンアノード)しており、セットの小型化、高密度実装が可能。
- ESD耐量が高い。
IEC61000-4-2 気中放電 ±15kV
IEC61000-4-2 接触放電 ±8kV
- スタンドオフ電圧 6.5V

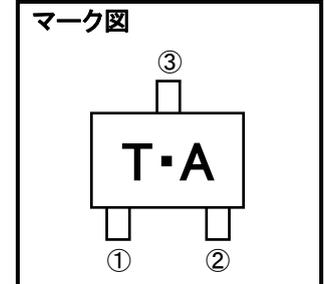
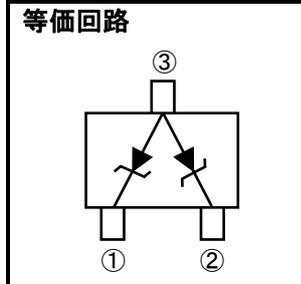
用途

外部インターフェイス回路の ESD 保護等



最大定格(Ta=25°C)

項目	記号	定格値	単位
全許容損失	P _T	200	mW
接合部温度	T _j	+150	°C
保存温度	T _{stg}	-55~+150	°C



電気的特性(Ta=25°C)

項目	記号	試験条件	特性値			単位
			最小	標準	最大	
降伏電圧	V _{BR}	I _R =5mA	7.76	8.20	8.64	V
逆電流	I _R	V _R =6.5V	-	-	0.5	μA
端子間容量	C _T	V _R =0V	-	60	-	pF

ESD 耐量

試験方法	ESD 耐量	単位
IEC61000-4-2 気中放電	±15	kV
IEC61000-4-2 接触放電	±8	kV

安全設計に関するお願い

- ・弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生する場合や誤動作する場合があります。弊社製品の故障または誤動作によって、結果として人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

- ・本資料は、お客様が用途に応じた適切なイサハヤ電子製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてイサハヤ電子が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、イサハヤ電子は責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他全ての情報は、本資料発行時点のものであり、特性改良などにより予告なしに変更することがあります。製品の購入に当たっては、事前にイサハヤ電子へ最新の情報をご確認ください。
- ・本資料に記載された製品は、人命に関わるような状況の下で使用される機器、あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、イサハヤ電子へ御照会ください。
- ・本資料の転載、複製については、文書によるイサハヤ電子の事前の承諾が必要です。
- ・本資料に関し詳細についてのお問合せ、その他お気付きの点がございましたら、イサハヤ電子まで御照会ください。